

《电子测试》征稿简则

《电子测试》(刊号: CN11-3927/TN, ISSN1000-8519)是北京市科学技术研究院主管,国内外公开发行的科技类学术期刊。《电子测试》期刊秉承一贯的专业性和权威性的办刊宗旨,坚持前瞻性、技术性和实用性的编辑方针,刊载最新电子技术和测试测量技术的研究论文,为测试测量及自动控制业界的工程师和技术研发人员提供了全新可靠的技术与应用和行业资讯。

《电子测试》创刊于1987年,见证了中国电子测试测量业的发展历程。如何为国际和国内市场提供有竞争力的产品、掌握先进的测试测量技术一直以来深受测试测量领域工程师和研究者的关注,而为他们搭建沟通行业信息的平台,开创学术交流的广阔空间则正是《电子测试》创刊以来的核心使命。众多科研院所、大专院校的科研精英和国内从事微电子行业和电子产品开发的科技人员已成为其忠实的读者群。

一、征文范围

本刊以综述、学术论文、研究简报等形式报道以下但不仅限于以下方面的科研成果:测试测量的基础理论、电参数测量、信号检测技术、传感器技术、仪器仪表技术、嵌入式技术、通讯技术、DSP、EMC/EMI测试、纳米测试、虚拟仪器技术、基于总线的测试、集成电路测试、在线测试与故障诊断、计算机在测控系统中的应用、图形图像处理技术、软件工程、网络技术、可编程器件在测控系统中的应用、微处理器应用,以及测试测量技术在航空航天、机械电子、医疗、智能家电和汽车电子、绿色制造及检测技术、高清晰视频和光电显示、标准认证及可靠性分析、半导体测试技术、通用测试技术等领域的应用等。

二、投稿要求

1. 论文要具有前沿性、创新性,主题明确、结构完整、层次分明、文字精炼,综述性论文或研究性论文皆可。
2. 学术重复度不超过20%(包括自己已发表过的文章),不允许一稿多投。
3. 稿件文责自负。编辑部对来稿有权做技术性和文字性修改,实质性内容修改须征得作者同意。
4. 投稿请严格遵守国家有关保密规定,不涉密。

三、写作要求

1. 稿件需提供作者简介、单位及通讯作者联系方式和研究方向等。
2. 题目、作者及单位、摘要、关键词的中英文;关键词3~8个,并与文章主要报道内容相关、具有实际意义;详细的中英文摘要(300~500字左右),应包括研究的问题、过程和方法、结果和结论3个层次。
3. 如获基金资助,请在文章首页地脚处标示出项目名称和编号。
4. 文中图表需清晰,用软件绘制的图尽量提供图表的矢量图,表格不能为图片,分图均需有分图题。
5. 文中公式或外文的每个字母必须分清大小写和正斜体,上下角标应标注清楚;公式中同一符号在一篇文章中只能有一个含义,每个符号均需在文中第一次出现的位置说明其含义。
6. 参考文献一般不少于10篇,综述性文章不少于20篇,参考文献应以文中出现的先后次序在正文中注明编号,并列于文后,参考文献的书写格式请参照“参考文献著录规则”。

四、联系方式

投稿邮箱: etest@vip.126.com

地址: 北京市海淀区丰贤中路7号院4号楼2层

期刊主页: <https://www.bjast.ac.cn/dzcs.shtml>

注: 本刊长期接收稿件,编辑部对稿件坚持同行评议的评审原则,对稿件实行快审快发和优先出版,保证投稿作者研究成果的及时发表。